中国漓完

第11卷 第1期

激光等离子体韧致辐射及其连续谱的测量

欧阳斌 林尊琪 余加进 甘柏辉 张秉钧

(中国科学院上海光机所)

提要:本文介绍激光等离子体韧致辐射 X 光连续谱的产生和测量,并给出了研制的韧致谱仪和测量的结果。

Emission and measurement of Bremsstrahlung spectrum from laser-plasma

Ouyang Bin, Lin Zunqi, Yu Jiajin, Gan Baihui, Zhan Bingjun

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: The emission and measurement of Bremsstrahlung spectrum from laser-plasma are discussed and the Bremsstrahlung spectrometer and the measured results are described.



由激光产生的高温高密度等离子体发射 的韧致辐射谱,对于了解等离子体的电子、超 热电子速度分布,等离子体对激光吸收机理 和靶的设计都是极为有用的。为了测量等离 子体韧致辐射谱,我们研制了 K 吸收边多道 韧致辐射 X 光连续谱仪,并在实验中取得较 好的结果。

韧致辐射 X 光的产生

利用激光能够在极短时间内把巨大的能量灌输给靶,使靶物质迅速离化,产生高温高密度等离子体。这种等离子体的复杂运动产生大量的各种形式的辐射,如中子辐射、X光辐射、二次谐波辐射等等,其中X光波段的

辐射也有称为电子的自由-自由辐射,是最令 人感兴趣的。

高温高密度等离子体的辐射中,电子的 自由-自由辐射是主要的辐射,强度分布可以 用下式给出:

$$I_{\lambda} = c \frac{n_i n_e z^2 l_o}{\lambda^2 \sqrt{KT}} \bar{g}_f \exp\left[-E/KT\right] \quad (1)$$

式中 n_i 、 n_e 为离子、电子密度; g_f 为 Gaunt 因 子; z为原子电荷数; λ 为波长;l为等离子体 范围; c为光速;K为玻尔兹曼常数;T为电 子温度;D为光子能量;C为常数,等于:

$$C = \frac{32 \, \pi^2 \, e^6}{\sqrt[3]{3} \, c^3 \, [2 \, \pi m]^{3/2}}$$

由式(1)知,从谱分布曲线斜率可得到电子温度。

收稿日期: 1982年9月1日。

测量原理

连续谱的测量,可以用分段法测出,再得 出连续谱;也可用有限个点取得谱分布值,然 后再得到完整的谱。我们的谱仪是后一种形 式的。其中测量点是由X光滤光片来确定的。

X 光通过物质时强度发生变化,从 I_0 变为I。它与物质的厚度D、密度 ρ 有下面的关系:

$$I = I_0 e^{-\mu\rho D} \tag{2}$$

μ 为质量吸收系数,它是入射的 X 光波长的 函数,与物质的原子壳层结构有关。在 X 光波 长范围内,出现几个突变,称为吸收边^{[21}。在 吸收边对应的波长处,吸收系数将随 X 光波 长的增加而急剧减少,即透过率突然增加。 也就是说,在吸收边附近 X 光透射强度急剧 地增加。各种金属都有吸收边,它与壳层的 名称相对应,分别称为 K 吸收边、L 吸收边 等,其中 K 吸收边最明显,不同金属的 K 吸 收边的能量位置是不同的。

鉴于激光等离子体韧致辐射谱的特点, 用多种金属的 K 吸收边特 性 作 X 射线的 波长选择元件尤其有利,因为它是指数下降 的谱分布,接近于麦克斯韦分布。这种谱分 布的 X 射线, 经 K 吸收边滤光片作用后,原 来连续的、极宽能带的 X 射线谱,变为分布 能带很窄的 X 射线,图1是其示意图。

对透过滤光片的 X 射线的测量 方法较多,我们是用碘化铯(铊)闪烁体和光电倍增



图1 K 吸收边作用示意图

管 GDB-14 组成的系统进行测量的。X 射线 使闪烁体发光,由倍增管接收,在负载上获得 电压。因此,连续谱的测量,就成了多个电压 讯号的测量,电压讯号的测量可以借助于电 子学系统。

实验用的韧致谱仪

我们用于实验的韧致谱仪包括探头和电 子系统两大部分,见方框图 2。



1. 探头

探头由八个探测器组成,每个的结构如 图 3 所示。它包括 K 吸收边滤光片、闪烁 体、中性滤光片、光导、光电倍增管、分压器、 前置放大器。元件的数值如附表。





八个探测器用的金属滤光片分别是铝、 钛、铜、钼、银、铒、钽、铅。它们的厚度由公式 (1)初算后,再由计算机模拟计算出最好的 值,挑选各道响应函数正交性好的一组,配制 八种滤光片。闪烁体厚度借用公式(2)计算, 但以 μ, ρ, t 代替 $\mu, \rho, D, \mu\rho$ 为按闪烁体中各 元素的权重比的平均值。附表中给出的滤光 片厚度为实际上使用的厚度,有些滤光片因 受产品的限制,自己磨制条件较差并没有用 理论计算值。闪烁体的厚度是实际探头内闪 烁体厚度,闪烁体是自己磨制的,有些厚度也 与理论计算有偏差。为了适应高低能区 X

· 21 ·

射线光强的巨大变化, 探头内插入了中性滤 光片, 它是用 LIFORD-2 型干板曝光后制成 的。它的作用是对闪烁体的光作衰减, 保证 倍增管工作在线性区。光电倍增管经过两种 光源(从恒定强度的光源中斩出脉 冲光 和毫 微秒星点光源)照明下挑选的, 选出特性稳定 的管子, 同时, 确定每个管子的工作电压。

前置放大器实际上是晶体管射极跟随器,主要是起阻抗匹配作用,把讯号送到较远 地方而损失较少。

2. 记录用的电子系统

电子系统包括放大器、脉冲-数字转换器、显示器和打印机等单元。

放大器是放大倍数自动调节式的,称为 浮点放大器。它的输出由激光控制的触发器 启动门电路后输给脉冲-数字转换单元。脉 冲经过 A-T 转换和 T-D 转换后,经显示器 给出幅度值。显示器可以慢、快不同速度对 各路巡回显示数字,打印机可以自动或起动 后打出各道值。放大器等系统,调整时做到 打印显示值即为输入脉冲的毫伏数。

谱仪的触发器是为了减少实验场地的干 扰而设置的。浮点放大是为适应各次激光等 离子体 X 射线产额因各种原因而大幅度变 化考虑的。

探头经过放射性同位素源和 X 光机激 发荧光特征线的反复标定,并实验测出直流-脉冲转换系数 $u=8.13 \times 10^{-7}$ 伏/千电子伏。 它表示每千电子伏特 X 光能量完全被探头 吸收后,探头给出宽为 T,高为 u 伏特的脉 冲。T 为激光激发探头时输出脉宽的实际 值,实验中拍得为 1 微秒(半高宽)。

实验结果

用韧致谱仪,在激光等离子体实验中测得的结果,用计算机算出发射谱的数字解,描出谱分布曲线(图 4)。

设韧致谱的辐射函数为 $f(\lambda)$, 谱仪的

响应函数为 $\phi_j(\lambda) = M_j \cdot G_j \cdot e^{-\mu_j \cdot \rho_j \cdot D_j} \cdot (1 - e^{-\overline{\mu_j} \rho_j t_j})$, 下标 j 表示第 j 道的响应函数, M_j 为第 j 道的包括倍增系数在内的灵敏度因 子, G_j 为第 j 道的包括收集效率有关的因 子, 其余同前。探头输出脉冲为 Y_j , 则:

$$Y_{j} = \left| \phi_{j}(\lambda) f(\lambda) d\lambda \right|$$
(3)

 $j=1, 2, 3, \dots, 8_{\circ}$

用计算机的数字解,从积分号内解出 $f(\lambda)$ 的 值和电子温度。用计算值作曲线(图 4)。



图 4 激光等离子体韧致辐射谱

实验中用的激光功率每路约4×10¹⁰ 瓦, 脉宽约1毫微秒,双向照明靶丸方式。 靶室 真空度约10⁻⁴ 托。曲线的斜率是电子温度。 各种靶材的温度都差不多,低温为500电子 伏,高温为~10千电子伏。各次强度有差 异,温度略有差别。大量的实验结果认为等 离子体温度与加温方式有关。

韧致辐射谱曲线从十几千电子伏起,就 偏离了麦克斯韦分布并曲线抬高。这一部分 X光是超热电子辐射产生的,超热电子越多, 谱的抬高越明显。

超热电子因为具有高的速度,在激光加 热时,它的存在将使靶的内层先加热,这种预 加热对于聚爆压缩是不利的,因此设计各种 靶时,超热电子的影响应该注意。在加热中, 由于超过10⁶K的情况下,等离子体中的X 射线带走大量的能量而造成冷却。

本工作的参加者还有曹金洲、周锦智、威 小妹、陆海鹤等。

附 表

道序		1	2	3	4	5	6	7	8
滤 光 片	· 元 素	Al	Ti	Cu	Mo	Ag	Er	Та	Pb
	K边位置(千电子伏)	1.56	4.96	8.98	20.0	25.5	27.5	67.4	88.0
	厚度(微米)	36	28	36	70	105	210	195	620
闪烁体	碘化铯(铊)厚(毫米)	0.4	0.6	0.6	0.8	2.5	2.5	2.5	5
中性滤片	衰减倍数	2×10^{4}	1.04	5×10^{2}	25	5	1	1	1
实 验 值 (毫伏)	CD2 靶 \$ 100 微米	1167	1162	1438	558	430	818	160	487
	CD ₂ 靶 φ 100 微米	1126	1030	1058	310	258	636	146	175
	充氘玻壳	1450	1280	1150	380	160	350	750	230
	充氘玻壳	1150	560	305	380	320	875	500	230

参考文献

[1] R. C. Elton, A. D. Anderson; Calculations Useful in the Dewtermination Temperature From X-Ray ContinuumRadiation Emitted High Temperature Plasmas, 1967, Naval Resarch Laboratory.

[2] A. N. 季达依哥罗茨基;"X 射线结构分析",科学 出版社,1958年。

简讯

用"频带选通谐振腔"获得宽频带激光输出

增加高功率激光的光谱带宽,不仅有利于等离 子体的吸收,提高布里渊散射的阈值,改善靶的照明 均匀性,防止热斑和超热电子的产生;更为重要的 是,在发展 Nd 玻璃高功率激光系统中,宽带激光的 相干性下降,并可以消除高级 Fresnel 衍射,抑制自 聚焦的增长,因而有可能大大地提高激光系统的输 出容量。

我们使用"频带选通谐振腔"技术,在 Nd 玻璃 激光系统中成功地获得 100Å 以上的宽带激光输出。 所谓"频带选通腔"是采用一种类似于宽带干涉滤光 片的反馈腔膜组成谐振腔,它压制中心波长光子数 的增殖,提升旁带的光子密度,使得在足够宽的频带 范围内,各种纵模同时进入振荡。这种方法产生宽 带激光比用等离子体滤波的方法 方 便得 多,目前 尚未见报导。

我们实验中使用的选通腔板对1.058 微米的透 过率57.7%,而在1.065 微米和1.050 微米处的透 过率分别下降到 38.8% 及 37.3%; 这是根据国 产 硅酸盐 Nd 玻璃的荧光光谱特性进行设计 的。实验 中可以使用折迭式腔使光束与选通腔板作用两次而 进一步提高选通的效果。

宽带激光振荡器的输出特性如下:带宽100Å; 中心波长1.060~1.063 微米;脉冲能量0.5 焦耳; 脉冲宽度70毫微秒。示波照相表明,由于它包含的 纵模数量很大,模式相干的结果使脉冲的时间过程 变得比较光滑。此外,我们还进一步观察到这种宽 带激光对消除相干条纹和 Fresnel 衍射方面的效果 是明显的。

关于宽带激光的放大与传输特性的研究工作正 在进行中。

(中国科学院上海光机所 余文炎 郑玉霞 梅 广 冷珍美 1983年7月20日收稿)

• 23 •